

## СОДЕРЖАНИЕ

### ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

- И. В. Бойков, Н. П. Кривулин.** Определение временных характеристик линейных систем с распределенными параметрами . . . . . 3

### НАНОМЕТРОЛОГИЯ

- В. П. Гавриленко, А. Ю. Кузин, В. Б. Митюхляев, А. В. Раков, П. А. Тодуа, М. Н. Филиппов, В. А. Шаронов.** Влияние контаминации в растровых электронных микроскопах на профиль рельефных элементов в монокристаллическом кремнии . . . . . 15

### ЛИНЕЙНЫЕ И УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- В. Л. Минаев.** Динамический интерференционный микроскоп для измерения параметров живых биообъектов . . . . . 24

### ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- Р. А. Эминов.** Предельная точность одно- и двухволновых методов измерения суммарного количества водяного паров в атмосфере с учетом влияния перистых облаков . . . . . 28

### ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- А. В. Завьялов, М. П. Пушин.** Методика отбраковки МОП-транзисторов по паразитному нежелательному открыванию . . . . . 33

## CONTENTS

### GENERAL PROBLEMS OF METROLOGY AND MEASUREMENT TECHNIQUES

- I. V. Boykov, N. P. Krivulin.** Determination of time characteristics of linear systems with distributed parameters . . . . . 3

### NANOMETROLOGY

- V. P. Gavrilenko, A. Yu. Kuzin, V. B. Mityukhlyayev, A. V. Rakov, P. A. Todua, M. N. Filippov, V. A. Sharonov.** Effect of contamination in a SEM on the profile of relief structures in the nanometer range . . . . . 15

### LINEAR AND ANGULAR MEASUREMENTS

- V. L. Minaev.** Dynamic interference microscope to measure the parameters of live biological objects. . . . . 24

### OPTICOPHYSICAL MEASUREMENTS

- R. A. Eminov.** Limiting accuracy one - and two-wave methods of measurement of total quantity water vapors in the atmosphere with the account influences of plumose clouds . . . . . 28

### ELECTROMAGNETIC MEASUREMENTS

- A. V. Zavyalov, M. N. Puschin.** Methodology of testing to detect parasitic undesirable turn-on MOSFET . . . . . 33